

分離工学セミナー「サブナノポア測定技術の最新動向:多孔質吸着剤および分離膜の開発に向けて」

主催:日本膜学会, 化学工学会膜工学分科会, 化学工学会中国四国支部, 中国地区化学工学懇話会,
CREST「多様な水源に対応できるロバスト RO/NF 膜の開発」

協賛:触媒学会, 日本吸着学会, 化学工学会, 日本化学会, (予定)

日時:2015年4月2日(木) 13:00-17:40

会場:広島大学工学部 117 教室(東広島市鏡山 1-4-1) <http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/general/access/>

趣旨:

吸着剤, 多孔質分離膜などにおいて, 1nm 以下のサブナノ領域の細孔は, 分離性の発現や新規材料開発の観点から極めて重要である。近年, 陽電子消滅法(Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy, PALS), DFT 法など新規なサブナノ細孔測定技術が発達し, より一般的に利用できるようになって来た。しかしながら, サブナノ細孔の評価法はまだまだチャレンジングであり, 開発研究の必要な分野である。本シンポジウムでは, サブナノ細孔に焦点を絞り, 粉末, フィルム, 膜としての測定例, 測定法について最新動向を概観する。

講演

- 1.陽電子消滅によるサブナノ空間解析:基礎と応用(産総研) 伊藤賢志氏
2. 陽電子消滅によるサブナノ空間解析:高品質ビームの形成と利用(産総研)オローク ブライアン氏
3. 陽電子消滅によるサブナノ空間解析:機能化学部材の評価(産総研)萩原 英昭氏
4. 蒸気吸着偏光解析法による多孔質薄膜の高感度細孔評価 (株東レリサーチセンター)吉本 茂氏
5. NLDFT 法による最先端のガス吸着細孔径分布解析技術 (カンタクローム・インスツルメンツ)佐藤 純氏
6. マルチガス拡散法によるサブナノ空隙構造評価 (広島大)吉岡朋久氏
7. 吸着を用いたゼオライト膜の非破壊測定手法およびその解析方法 (早稲田大)瀬下雅博氏
8. Normalized Knudsen-based Permeance (NKP)によるアモルファスシリカ膜の細孔径評価 (広島大)金指正言氏

参加費 無料

申込・問合せ先 〒739-8527 東広島市鏡山 1-4-1 広島大学工学研究院化学工学専攻 金指正言

電話/FAX 082-42-7714 E-mail: kanezashi@hiroshima-u.ac.jp

<http://home.hiroshima-u.ac.jp/membrane/index.html>